

S01: Capabilité des process de mesure



Objectif:

Maîtriser les outils statistiques mesurant la variabilité inhérente à un système de mesure.



Concrètement vous serez capable de:

Caractériser et classifier la variabilité introduite par la mesure par rapport à la variation totale observée.



Vous aimerez:

Challenger vos équipements de mesure en terme d'exactitude et/ou de précision.



Prérequis:

Maîtrise des statistiques de base.



Durée:

1 journée (7h)



Programme:

- Introduction
- Problématique de la mesure
- Décomposition de l'erreur de mesure
- Etudes d'exactitude
- Justesse
- Linéarité
- Stabilité
- Etudes de Précision
- Répétabilité
- Reproductibilité
- Méthode ANOVA